

*Письма в ЖЭТФ, том 15, вып. 9, стр. 537 – 540*

5 мая 1972 г.

**РАЗРУШЕНИЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА  
В РЕЗУЛЬТАТЕ СВЕРХПЛОТНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ  
ЕГО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ**

*Д. И. Вайсбурд, И. Н. Балычев*

1. Процессы, происходящие в треке тяжелой ионизирующей частицы, моделировались в макроскопических объемах твердых тел. Образцы облучались кратковременно ( $\sim 10^{-8}$  сек) мощным потоком электронов так, чтобы средняя плотность энергии возбуждений достигала, как в сердцевине трека,  $W \sim 10^{20} - 10^{22}$  эв/см<sup>3</sup> [1]. Для этого нами изготовлен и приспособлен ускоритель со следующими параметрами импульса электронов: верхняя энергия частиц 0,3 Мэв; длительность регулируется в интервале  $(7 - 30) \cdot 10^{-9}$  сек; а плотность тока — в пределах  $(0,01 - 1) \cdot 10^3$  а/см<sup>2</sup>. Ускоритель разработали Месяц и Ковальчук; в нем используется явление взрывной автоэмиссии с остряйного катода в сильных электрических полях [2]. Мы обнаружили, что облучение одиночным импульсом вызывает разрушение твердого тела, если средняя плотность энергии, поглощенной за время импульса, превосходит

характерный для этого вещества порог  $W_{\text{разр}}$ . Эффект проявляется следующим образом: 1) тонкие пластинки 0,01 – 0,5 мм ионных ( $\text{LiF}$ ,  $\text{NaF}$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{KCl}$ ,  $\text{KBr}$ ,  $\text{CaF}_2$ ) и ковалентных ( $\text{Ge}$ ,  $\text{Si}$ ) кристаллов испытывают хрупкое разрушение, раскалываясь на части. Число осколков бывает велико и зависит от плотности пучка  $\Phi$ . Величина  $\Phi_{\text{разр}}$  и  $W_{\text{разр}}$  определялись из условия разрушения образца на два осколка.

	$\text{Ge}$	$\text{LiF}$	$\text{NaF}$	$\text{NaCl}$	$\text{KCl}$
$\Phi_{\text{разр}}, 10^{13} \text{ электронов}/\text{см}^2$	3,0	1,7	1,3	1,1	0,7
$W_{\text{разр}}, 10^{20} \text{ эв}/\text{см}^3$	15,0	3,0	2,3	2,0	1,1

2) В толстых образцах возникают фигуры Лихтенберга, состоящие из трещин толщиной 0,1 – 1 мкм. 3) В пластичных телах наблюдаются следы взрывного радиолиза: пузырьки газа, вслучивание и эрозия поверхности. Используемые для облучения электроны практически всю энергию, теряемую в веществе, передают прямо его электронной подсистеме (ЭП) и только незначительную часть,  $\sim 10^{-4}$  – непосредственно ядерной (ЯП). Таким образом, в наших экспериментах показано, что непосредственное возбуждение только ЭП твердого тела может привести к его хрупкому разрушению, и установлен необходимый для этого порог,  $W_{\text{разр}}$ .

2. Самые низкие  $W_{\text{разр}}$  наблюдаются у щелочногалоидных кристаллов (ЩГК). При таких уровнях возбуждения не разрушаются ни металлы, ни полупроводники, ни стекла, ни органические диэлектрики. Разрушение твердых тел под действием мощных излучений обычно связывают с электрическим пробоем или нагреванием [3]. Эксперименты показывают, что ни первое, ни второе не являются в данном случае причиной разрушения ЩГК. 1) В образец, толщина которого больше пробега электронов (0,45 мм в  $\text{NaCl}$ ), вносится заряд  $\sigma = e\Phi_{\text{разр}} = 10^{-6} - 10^{-5} \text{ к/см}^2$ . за импульс. По уравнению Пуассона поле при этом достигает  $2\pi\sigma/k \approx 10^6 - 10^7 \text{ в/см}$  и может вызвать пробой ( $k$  – диэлектрическая проницаемость). Действительно, в толстых пластинках оргстекла и других диэлектриков возникало большое число каналов незавершенного пробоя. Следы пробоя отсутствуют в тонких пластинках тех же веществ, так как в них поглощается меньше электронов. Но эффект разрушения сохраняется. Прямыми измерениями заряда пучка электронов до и после образца  $\text{NaCl}$  показано, что при уменьшении его толщины от 0,45 до 0,01 мм поглощенный заряд уменьшается более, чем в 10 раз, а  $W_{\text{разр}}$  и  $\Phi_{\text{разр}}$  изменяются менее, чем на 20%. Не устраняет разрушения нанесение на поверхность платиновых электродов и завертывание в заземленную алюминиевую фольгу. Тонкие пластинки ЩГК получены методом растворения и химического полирования. 2) Даже полное превращение  $W_{\text{разр}}$  в тепло нагревало бы  $\text{NaCl}$  всего на  $20^\circ$ . Прямыми экспериментами мы показали, что при таком нагреве механические напряжения, возникающие за счет градиентов температуры, не могут привести к разрушению. Использовался пучок диаметром 5 мм. Интенсивности в центре и на краях отличались не

более, чем на 25%. Размер образцов  $4 \times 4 \times 0,1 \text{ мм}$  гарантировал отсутствие существенных градиентов температуры как по поверхности, так и по толщине образца. Измерения показывают, что в пластинках  $\text{NaCl}$ , толщиной  $0,1 \text{ мкм}$ , поглощается не более 30% пучка электронов. Затем часть образца закрывалась пластинкой кристалла. Чистота поверхностей скола последнего обеспечивала резкую в пределах  $1 \text{ мкм}$  границу между облученной и необлученной частями. Здесь создавался максимально возможный при  $W_{\text{разр}}$  градиент температур. Однако разрушающие трещины возникали в центре образца, где плотность пучка была выше. Известно, что взаимодействие возбужденной ЭП с ЯП приводит не только к нагреванию, но и образованию радиационных дефектов. За  $10^{-15} - 10^{-11} \text{ сек}$  все высокоэнергетические возбуждения ЭП превращаются в низкоэнергетические: электроны и дырки, которые при безызлучательной рекомбинации в ШГК эффективно создают  $F$ -центры и междуузельные атомы. На пару таких дефектов затрачивается  $40 - 100 \text{ эв}$  [4]. Таким образом, за счет  $W_{\text{разр}}$  в  $\text{NaCl}$  может образоваться не более  $5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$  пар дефектов. Облучая  $\text{NaCl}$  протонами, мы доводили концентрации этих дефектов до  $5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ , но при этом кристаллы не разрушались [5]. Складывается впечатление, что при равномерном распределении поглощенной энергии, равной  $W_{\text{разр}}$ , разрушение кристаллов маловероятно. Учет случайных (шуссоновских) флуктуаций числа падающих электронов, вторичных возбуждений и радиационных дефектов показывает, что они не существенны. Действительно, в треках высокоэнергетических ионов плотность электронных возбуждений может намного превосходить  $W_{\text{разр}}$  [1]. Но это не приводит к хрупкому разрушению образца, а только к сильным локальным изменениям. Для разрушения необходимо, чтобы наименьший линейный размер возбужденной области  $\ell_{\text{разр}}$  был намного больше диаметра трека, равного  $0,001 - 0,01 \text{ мкм}$  [1]. Мы приняли  $\ell_{\text{разр}} \sim 0,1 - 1 \text{ мкм}$ ; это порядка толщины трещин. Случайные флуктуации в таких областях ничтожны.

При  $W_{\text{разр}}$  в ШГК образуется плотная сетка взаимодействующих электронов и дырок с интервалом  $30 - 50 \text{ \AA}$ . Мы предполагаем, что их конденсация приводит к образованию в ШГК макрообластей с плотностью энергии возбуждений, намного превышающей среднюю. Впервые Келдыш [6] рассмотрел возникновение "электронно-дырочных капель" в полупроводниках. Там экситон имеет большой радиус  $a \sim 100 \text{ \AA}$  и малую энергию связи  $\epsilon \sim 0,02 \text{ эв}$ . Поэтому электроны и дырки объединяются в конденсоны Ванье – Мотта – Келдыша с равновесной плотностью частиц  $10^{17} - 10^{18} \text{ см}^{-3}$ , стабильные при низкой температуре. В ШГК  $a$  порядка межатомного расстояния, а  $\epsilon \sim 1 \text{ эв}$ . Поэтому, мы полагаем, система электронов и дырок при комнатной температуре способна сжиматься в конденсоны Френкеля с равновесной плотностью  $10^{21} - 10^{22} \text{ см}^{-3}$ . При этом  $W$  может достигать плотности энергии связи, что заведомо достаточно для разрушения.

Томский  
политехнический институт  
им. С.М.Кирова

Поступила в редакцию  
2 марта 1972 г.  
После переработки  
4 апреля 1972 г.

## Литература

- [ 1 ] Д.И.Вайсбурд, Н.С.Кравченко, Л.А.Меликян, П.Д.Алексеев. Изв. АН СССР, Сер. физ., 35, 1364, 1971; Д.И. Вайсбурд, А.А.Воробьев, Л.А.Меликян. АЭ, 30, 538, 1971.
  - [ 2 ] Г.А.Месяц и др. Известия высш. уч. зав., Физика, №5, 153, 1969.
  - [ 3 ] С.И.Анисимов и др. Действие излучения большой мощности на металлы. Москва, 1970.
  - [ 4 ] M.Hirai, Y.Kondo, T.Yoshinari, M. Ueta. J. Phys. Soc. Japan, 30, 1071, 1971.
  - [ 5 ] Д.И.Вайсбурд, С.М.Минаев, Н.Л.Терентьев. Изв. АН СССР, сер. физ., 33, 870, 1969.
  - [ 6 ] Л.В.Келдыш. Труды IX Международн. конф. по физике полупроводников, Москва, 1969.
-